

Journée technique
« Analyse et contrôle en ligne pour des procédés mettant en œuvre des poudres »

10 octobre 2018, Ecole des Mines de Saint Etienne

Programme

Accueil à partir de 8h45

09h15

Introduction

Cyril DARTIGUELONGUE, AXELERA

09h30

Session 1 : analyse granulométrique

Le contrôle en ligne de la granulométrie d'une poudre après broyage chez ELKEM (20')

Jacques Grollemund, ELKEM Silicones

Analyse comparative granulométrique de poudres de lignine Kraft par diffraction Laser et analyse d'Image : Etude de l'influence des conditions de préparation des échantillons (20')

Frédérique Bertaud, CTP (Centre Technique du Papier)

Mesure de granulométrie en ligne sur broyeur cryogénique (10')

David Bordeaux, SDTech

PITCH—Mesures de distributions de tailles de nanoparticules sous forme de poudres et de dispersions dans des liquides ou des matrices (5')

XENOCS—NANOMAKERS

PITCH—Apport de la granulométrie en ligne au contrôle de procédés industriels (5')

MALVERN

10h30

Pause

10h50

Session 2 : spectroscopie, contrôle de procédés

Analyse de la stoechiométrie de nanopoudres en ligne et en temps réel par technique LIBS (20')

Christophe Dutouquet, INERIS

Analyse NIR at-line et in-line d'un procédé de polymérisation industriel (20')

Jean Guilment, ARKEMA

PITCH—Optimisation des procédés de séchage de poudres dans l'industrie pharmaceutique par spectroscopie proche infrarouge (5')

METROHM

Analyse de l'interaction laser/poudre (pour la fabrication additive) (10')

Nathalie Maillol, IPC (Innovation Plasturgie Composites)

PITCH—Mesure d'épaisseur de tous types de revêtements (peintures, revêtements poudres) (5')

ENOVASENSE

12h00

Animation networking

Journée technique
« Analyse et contrôle en ligne pour des procédés mettant en œuvre des poudres »

10 octobre 2018, Ecole des Mines de Saint Etienne

Programme (suite)

12h30

Cocktail déjeunatoire
Showroom (exposition de matériel)

14h00

Session 3 : caractérisation, traitement de données, capteurs

Mesure en ligne de suspensions : taille et potentiel Zeta (10')

David Bordeaux, SDTech

Apport de l'analyse d'image pour la caractérisation morphologique de milieux granulaires (20')

Johan Debayle, Ecole des Mines de Saint Etienne

PITCH—Apport de l'analyse de données multivariées pour la supervision et le pilotage de procédés (5')

ONDALYS

PITCH—Solutions de mesure en ligne dans le domaine des poudres (5')

ENVEA

PITCH—EDITbyCEFEM : Solutions de mesure d'humidité, de débit de solide et de contrôle en ligne (5')

CEFEM PROCESS

14h45

Animation brainstorming
Echange sur les problématiques et besoins liés à l'analyse et à l'instrumentation

16h30

Conclusion